

International Symposium on Reliability

“電子機器・集積回路の信頼性に関する国際シンポジウム”

<http://www-vlsi.es.kit.ac.jp/SERconf/intconf2018/>

日 時 2018/3/19(月) 13:00-17:50
申込締切 2018/3/12(月) (予定)
参加費 無料(レセプションを除く)
開催場所 京都工芸繊維大学 60周年記念館
主催 京都工芸繊維大学グリーンイノベーションセンター
協賛 IEEE SSGS Kansai Chapter, IEEE SSGS Japan Chapter, 学振 165 委員会

ソフトエラーなどの一時故障, BTI などの経年劣化など電子機器や集積回路の信頼性に関する5つの講演を実施します。CiscoのCharles Slaymanは元SunMicrosystemsの技術者でソフトエラー測定法の国際標準であるJESD 89Aを89Bに改定するWGのマネージメントを行っている著名な研究者です。ソフトエラーに関するキーノート講演をお願いしています。キーノートと招待講演者は下記の5名を予定しております。

キーノート

Dr. Charles Slayman (Cisco Systems)

システムやネットワークなどのソフトエラーについて(予定)

招待講演

1. Prof. Chris Kim(ミネソタ大の准教授)
集積回路の劣化を正確に見積もることのできるSilicon Odometerの歴史について
2. Dr. Frank Schlaphof (グローバルファウンドリ)
SRAMのソフトエラー率の測定法
3. Dr. Vincent Huard (ST マイクロ)
経年劣化等の長期信頼性関連
4. Prof. Jinshun Bi (中国科学院微电子研究所)
フラッシュメモリなどのNVMの信頼性と放射線効果

どなたでも参加いただけますが、事前登録をお願い致します。詳細と登録は

<http://www-vlsi.es.kit.ac.jp/SERconf/intconf2018/>

(<http://officepolaris.co.jp/INTCONF/index.html> にリダイレクトします)

よりお願い致します.